


**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 213**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 3 z/of 21.04.2026

 AP 213	Nazwa i adres / Name and address Laboratorium Wzorcujące Mikro Styk Sp. z o.o. ul. Mazurska 27 82-300 Elbląg
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand ¹⁾ 6.01 długość

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

**Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 213 z dnia 21.04.2026 r.
Cykl akredytacji od 28.10.2022 r. do 27.10.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl**

This document is an annex to accreditation certificate No AP 213 of 21.04.2026
Accreditation cycle from 28.10.2022 to 27.10.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Wzorcujące Mikro Styk Sp. z o.o. ul. Mazurska 27, 82-300 Elbląg				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,1 mm 0,01 mm	0 mm do 50 mm 0 mm do 50 mm	0,02 mm 0,005 mm	S	Procedura wewnętrzna MS-I-07-00 z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm	0 mm do 50 mm	0,005 mm	S	Procedura wewnętrzna MS-I-07-00 z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
Głębokościomierze suwmiarkowe	0 mm do 500 mm	0,06 mm	S	Procedura wewnętrzna MS-I-02-00 z zastosowaniem płytek wzorcowych
Mikrometry zewnętrzne	0 mm do 50 mm 50 mm do 100 mm 100 mm do 150 mm 150 mm do 175 mm 175 mm do 225 mm 225 mm do 250 mm 250 mm do 300 mm 300 mm do 325 mm 325 mm do 375 mm 375 mm do 400 mm 400 mm do 450 mm 450 mm do 475 mm 475 mm do 525 mm 525 mm do 550 mm 550 mm do 600 mm 600 mm do 625 mm 625 mm do 650 mm 650 mm do 700 mm 700 mm do 725 mm 725 mm do 775 mm 775 mm do 800 mm 800 mm do 850 mm 850 mm do 875 mm 875 mm do 925 mm 925 mm do 950 mm 950 mm do 975 mm 975 mm do 1000 mm	0,003 mm 0,004 mm 0,005 mm 0,006 mm 0,007 mm 0,008 mm 0,009 mm 0,010 mm 0,011 mm 0,012 mm 0,013 mm 0,014 mm 0,015 mm 0,016 mm 0,017 mm 0,018 mm 0,019 mm 0,020 mm 0,021 mm 0,022 mm 0,023 mm 0,024 mm 0,025 mm 0,026 mm 0,027 mm 0,028 mm 0,029 mm	S	Procedura wewnętrzna MS-I-04-00 z zastosowaniem płytek wzorcowych
Suwmiarki	0 mm do 400 mm 0 mm do 600 mm 0 mm do 1000 mm	0,02 mm 0,03 mm 0,04 mm	S	Procedura wewnętrzna MS-I-01-00 z zastosowaniem płytek wzorcowych
Średnicówki czujnikowe	4 mm do 65 mm 65 mm do 115 mm 115 mm do 155 mm 155 mm do 195 mm 195 mm do 235 mm 235 mm do 270 mm 270 mm do 300 mm	0,003 mm 0,004 mm 0,005 mm 0,006 mm 0,007 mm 0,008 mm 0,009 mm	S	Procedura wewnętrzna MS-I-08-00 z zastosowaniem płytek wzorcowych

Wersja strony: A

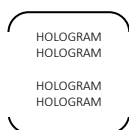
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe	50 mm do 100 mm	0,004 mm	S	Procedura wewnętrzna MS-I-09-00 z zastosowaniem płytek wzorcowych
	100 mm do 150 mm	0,005 mm		
	150 mm do 175 mm	0,006 mm		
	175 mm do 225 mm	0,007 mm		
	225 mm do 250 mm	0,008 mm		
	250 mm do 300 mm	0,009 mm		
	300 mm do 325 mm	0,010 mm		
	325 mm do 375 mm	0,011 mm		
	375 mm do 400 mm	0,012 mm		
	400 mm do 450 mm	0,013 mm		
	450 mm do 475 mm	0,014 mm		
	475 mm do 525 mm	0,015 mm		
	525 mm do 550 mm	0,016 mm		
	550 mm do 600 mm	0,017 mm		
	600 mm do 625 mm	0,018 mm		
	625 mm do 675 mm	0,019 mm		
	675 mm do 700 mm	0,020 mm		
	700 mm do 725 mm	0,021 mm		
	725 mm do 775 mm	0,022 mm		
	775 mm do 800 mm	0,023 mm		
	800 mm do 850 mm	0,024 mm		
	850 mm do 875 mm	0,025 mm		
	875 mm do 925 mm	0,026 mm		
	925 mm do 950 mm	0,027 mm		
	950 mm do 975 mm	0,028 mm		
	975 mm do 1025 mm	0,029 mm		
1025 mm do 1050 mm	0,030 mm			
1050 mm do 1100 mm	0,031 mm			
1100 mm do 1125 mm	0,032 mm			
1125 mm do 1175 mm	0,033 mm			
1175 mm do 1200 mm	0,034 mm			
1200 mm do 1225 mm	0,035 mm			
1225 mm do 1275 mm	0,036 mm			
1275 mm do 1300 mm	0,037 mm			
1300 mm do 1350 mm	0,038 mm			
1350 mm do 1375 mm	0,039 mm			
1375 mm do 1400 mm	0,040 mm			
Wysokościomierze suwmiarkowe	0 mm do 500 mm	0,06 mm	S	Procedura wewnętrzna MS-I-03-00 z zastosowaniem płytek wzorcowych
	0 mm do 1000 mm	0,08 mm		

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 213

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 21.04.2026 r.